

X線分析顕微鏡 (XGT) 見学会兼観察デモ



内蔵されたCCDカメラの光学像で試料を観察しながら、透過X線及び蛍光X線のイメージングや微小部(最少10 μ m)のスペクトルを得ることができる、顕微鏡とX線分析装置が一つになった装置です。

この度、見学会兼観察デモを開催しますので、お気軽にお越しください。

日時: 7月27日(水) 13:30 ~ 16:00

(上記時間帯のご都合の良い時にお越しください)

場所: 理系複合棟 318室

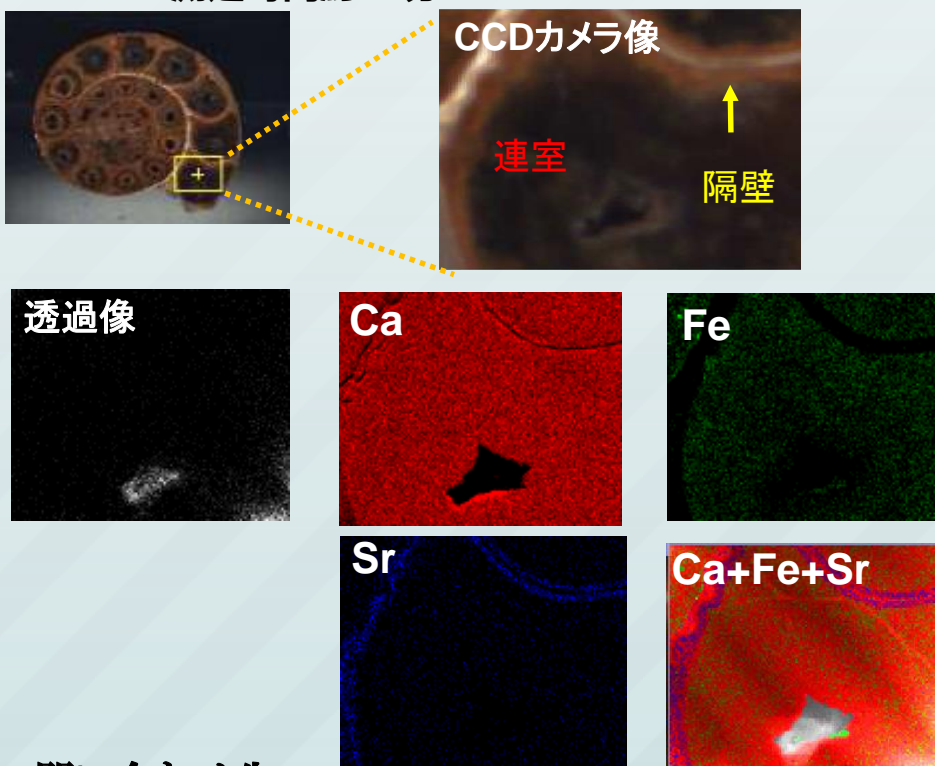
**装置名: X線分析顕微鏡 XGT-7200V
(HORIBA)**

担当: 石川 良介 (機器分析支援センター)

参加申し込みは不要です。但し、観察・分析をご希望の試料をお持ちの方は、事前に相談をお願いします。

マッピング測定

試料: アンモナイト
観察条件: 管電圧30kV, 管電流1mA,
X線照射径100 μ m, 大気状態,
測定時間約10分



スペクトル測定

試料: アンモナイト
観察条件: 管電圧30kV, 管電流1mA, X線照射径10 μ m,
全体真空, 測定時間2分/1箇所

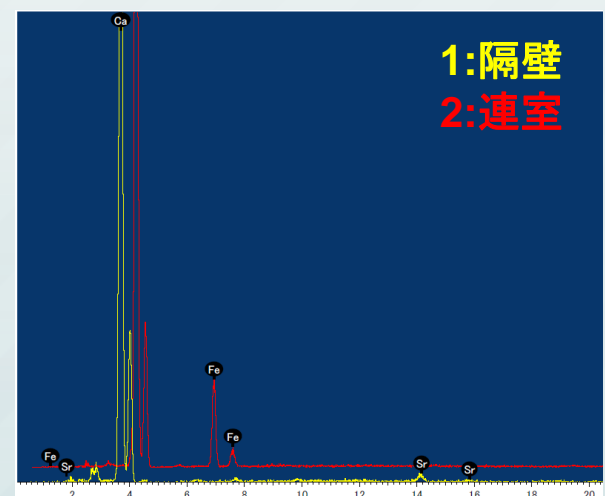


表. 各部位における組成比(酸化物換算)

No.	CaO [%]	Fe ₂ O ₃ [%]	SrO [%]
1	99.28	—	0.72
2	91.54	8.46	—

問い合わせ先

機器分析支援センター事務室 (理系複合棟307号室)
TEL: 895-8967 E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp

泉水仁

HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催: 機器分析支援センター